(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-306545

(43)公開日 平成4年(1992)10月29日

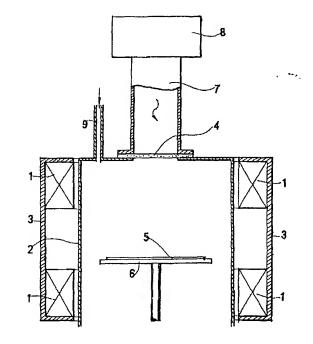
C 2 3 C 14 H 0 1 J 27	/16 /305	庁内整理番号 9069-5E 8414-4K 7247-5E 9172-5E 7353-4M	FI	審査請求	未請求	技術表示箇所 請求項の数 2 (全 5 頁)
(21)出願番号	特顯平3-99410		(71)出願人		42 機株式会社	±
(22)出願日	平成3年(1991)4月	∄3日		京都府京	都市右牙	京区梅津高畝町47番地
			(72)発明者	藤原 修一 京都市右京区梅津高畝町47番地日新電機株 式会社内		
			(74)代理人	弁理士	川瀬	支樹

(54) 【発明の名称】 ECR型イオン源

(57)【要約】

【目的】 ECR型イオン源をエッチング装置として用 いるときに、大きい面積のウエハに対して均一にエッチ ングでき、しかもウエハの位置設定が容易な装置を提供 すること。

【構成】 真空チャンパの外側に配置する励磁コイルを 2つにして、それらを軸方向にコイル長以上離隔して設 置し、励磁コイルの外側と外端とを包み込む鉄心を設け ること。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マイクロ波源と、真空チャンバと、真空 チャンパの中に設けられたウエハ支持台と、真空チャン パの中へマイクロ波を導入するための導波管と、導波管 と真空チャンパの間に設けられたマイクロ波導入窓と、 真空チャンパの外側に設けられ真空チャンパの内部に軸 方向の磁場を生ずる2つの励磁コイルとを含み2つの励 磁コイルがウエハ支持台を含む平面よりも反対方向にコ イル長以上に離れていることを特徴とするECR型イオ ン源。

【請求項2】 マイクロ波源と、真空チャンバと、真空 チャンパの中に設けられたウエハ支持台と、真空チャン パの中へマイクロ波を導入するための導波管と、導波管 と真空チャンバの間に設けられたマイクロ波導入窓と、 真空チャンパの外側に設けられ真空チャンパの内部に軸 方向の磁場を生ずる2つの励磁コイルとを含み2つの励 磁コイルがウエハ支持台を含む平面よりも反対方向にコ イル長以上に離れており、2つの励磁コイルの外周及び 外端面を囲むように鉄心を設けた事を特徴とするECR 型イオン源。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はECR型イオン源をエ ッチング装置として用いたときに、ウエハの面内に於い てエッチングレートが均一になるようにした改良に関す る。

[00002]

【従来の技術】イオン源というのは、真空チャンバの中 に原料ガスを導入し、アーク放電、高周波放電、マイク 口波放電などによってプラズマ化し、イオン引き出し電 30 極の作用によりイオン引き出すものである。イオンはさ らに加速されて対象物に打ち込まれる。

【0003】 ECR型イオン源というのは、原料ガスを 励起する手段としてマイクロ波共鳴吸収を使うものであ る。2. 45 GHz のマイクロ波を発生させ、導波管の 中を伝搬させ、セラミックの窓から真空チャンパの中へ 導入させる。真空チャンパの外側には縦方向(軸方向) の磁場を発生させるコイルが設けられる。これがある領 域に875ガウスの磁束密度を生ずるので、マイクロ波 共鳴吸収が起こり、プラズマの生成が盛んになる。

【0004】イオン源なのであるから、本来イオンを発 生させるためのものであり、真空チャンパの中には何も 存在せず、出口に3枚又は2枚の引き出し電極があるの である。励磁コイルもひとつであって、真空チャンパの かなりの領域でマイクロ波の共鳴が起こっていればよい のである。

【0005】ところで、イオン源なのであるからプラズ マを生成することができる。イオンは加速してやればか なりの運動量を持つためこれをエッチングに使うことが

く膜の除去のために使うのである。イオンとしてはアル ゴンなどの希ガスを用いることができる。これは物理的 衝力によって膜の表面を除去する。またハロゲンや酸 素を含むガスも用いられる。これは物理的、化学的に膜 を除去できるのである。

【0006】ECR型イオン源はもともとイオン源であ るのでエッチングに向くような設計がされていない。図 2と図3に従来例に係るECR型イオン源の概略を示 す。励磁コイル1が真空チャンパ2の中程を囲むように 設けられている。イオン源として利用する場合これで良 いのであるが、エッチング装置とする場合は図2のよう に、真空チャンパ2の中に、ウエハ5とウエハ支持台6 が設置されることになる。真空チャンパ2の一方の端面 中央にはマイクロ波導入窓4がある。これはセラミック で作られる。これは導波管7を介してマイクロ波源8に つながっている。

【0007】ガス入口9から導入されるガスもイオン源 とする場合とエッチング装置とする場合で異なってく る。これは当然である。ところがこのエッチング装置で 20 は、ウエハ面内でのエッチングの速さが不均一であっ て、エッチング後の膜の厚さが不均一になってしまう。 例えば、励磁コイルは次のような仕様となっている。

コイル内径

 $300 \text{ mm} \phi$

コイル長

8 0 mm 60 (6段×10列)

巻数 電流

100A

コイルとウエハの高さはほぼ同じであるとする。磁束は ウエハに直交しているのが最も好ましい。イオンは磁束 のまわりにサイクロトロン運動するので磁束がウエハに 直交していれば、イオンもウエハへ直角に入射できるか らである。またコイルの丁度中間のあたりで磁束密度が 最も高いからである。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところが有限の長さの コイルの内部の磁界であるから、コイル面に平行な面に 於いて磁束密度が一様にはならないのである。図4に2 つの励磁コイルが近接して置かれたときのコイルで囲ま れる内部空間の磁束密度分布を示している。ただしここ では後に本発明のものと比較するためコイルは2つ設置 してある(実際はコイルはひとつである)。本発明の効 果がコイルを増やしたことによるのではないことを示す ためである。諸元は前述のとおりである。これは中心軸 で切った半分の領域のみを示す。コイルの中央部の磁束 密度は約350ガウスで弱い。しかし周縁部では500 ガウスにもなる。コイルに近いところで磁束密度が大き くなるのは当然である。

【0009】エッチングの強さはイオンを収束させる強 さに比例するので磁束密度の強さにほぼ比例するといえ る。すると、広いウエハ(例えば8インチウエハ)の場 できる。つまりイオン源として膜の形成に使うのではな 50 合、周縁でのエッチング速度は速いが、中央部は遅いと .3

いうことになり不均一になる。エッチング速度が違うから、エッチングの深さが異なってしまう。

【0010】もうひとつの欠点がある。磁束の向きは、軸方向成分(Bz)が大きく、半径方向成分(Br)が小さいというのが望ましいわけである。ここでコイルの軸を z 軸としている。コイル面が x y 平面にある。Brが大きいと磁束がウエハ面に斜めに交わることになりイオンの入射も斜めになって好ましくない。例えば Br/Bzが5%以下にしたいとする。

【0011】図6に従来例の装置に於いて|Br/Bz| 10 |=0.05である部分の軌跡を示している。z 軸はコイルの中心を通るように取ってある。R 軸は半径方向の軸で原点はコイルの中心に合わせてある。R=R。がコイルの巻線部である。これもz 軸で切った半分だけを示している。コイルの中央の面z=0では|Br/Bz|が0.05以下とはならず、 $|Br/Bz| \le 0.05$ となる領域の範囲Dが約30mm程度で極めて狭い。ウエハの高さをこの中に設定しなければいけないということになる。

【0012】ECR型イオン源をエッチング装置として用いる場合に於いて、磁場の強さが一様である領域が広く、しかも | Br/Bz | < 0.05であるような領域が広いようにした装置を提供することが本発明の目的である。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明のイオン源はマイクロ波源と、真空チャンパと、真空チャンパの中に設けられたウエハ支持台と、真空チャンパの中へマイクロ波を導入するための導波管と、導波管と真空チャンパの間 30 に設けられたマイクロ波導入窓と、真空チャンパの外側に設けられ真空チャンパの内部に軸方向の磁場を生ずる2つの励磁コイルとを含み2つの励磁コイルがウエハ支持台を含む平面よりも反対方向にコイル長以上に離ていることを特徴とする。

[0014]

【作用】図1によって本発明のECR型イオン源の概略を説明する。2つの励磁コイル1、1が真空チャンバ2のまわりに設けられる。励磁コイル1、1はコイル長以上に離れている。さらに2つの励磁コイル1、1の外周 40面と外端面とを囲む鉄心3を設けている。マイクロ波源8で生じたマイクロ波が導波管7を通りマイクロ波導入窓4を通って真空チャンバ2に入る。ガス入口9からエッチング用のガスが導入される。

【0015】真空チャンバ2の中にはウエハ5を戴せた ウエハ支持台6がある。このような構造であると、ウエ ハの近傍の面内での磁束密度の均一性が高い。つまりコ イルの近くで磁束密度が高くなり過ぎたわけであるが、 本発明の場合、ウエハの存する平面内にコイルがないか ら、ウエハの周縁部で磁束密度が高くならないのであ 50 側の部分の等磁束密度線図。

る。

【0016】磁束はコイルの内部で軸にほぼ平行であるが、コイル端に近づくに従い拡がる。ところが本発明では、2つのコイルが互いに離れているので磁束が平行である部分が長くなる。このため |Br/Bz|が小さい領域が拡がるのである。

[0017]

【実施例】前記のコイルと同じコイル2つを100mm 離したものを作った。

10 コイル内径 3 0 0 mm φコイル長 8 0 mm

巻数 60 (6段×10列)

電流 100A 距離 100mm

【0018】図5に等磁束密度線を示す。2つのコイルから等しい距離だけ離れている原点0の近傍では磁束密度が約350ガウスであるが、図4の場合と違って2=0の面内で広く一定である。コイルの内壁近傍では500~600ガウスと大きくなるが、これは2=0の面と2方向に大きく離れている。図4と図5を比較して面内磁束密度の均一性の優れている事は明らかである。

【0019】図7に|Br/Bz|=0.05である位置の軌跡を示す。|Br/Bz|<0.05である軸方向の広がりQが長くなっている。従来例の場合Q=30cmであったが、この実施例ではQ=136cmになっている。約4倍に拡大している。

【0020】2つの磁石を離せば離すほどこの領域の長さは拡大する。しかしそうすると、中心での磁束が弱くなりイオンを導く作用が減退してしまう。鉄心3はコイルの外側での磁気回路の磁気抵抗を減らすものであり、コイル内側での磁束密度を増強する作用がある。これは炭素鋼などの強磁性体とする。鉄心がなければ、コイルを離隔すると、原点(z=0, R=0)近傍での磁束密度が弱くなってしまう。もちろん、この点はコイル電流を増やすことにより補填することは可能である。

[0021]

【発明の効果】ECR型イオン源をエッチング装置として用いる場合、本発明はコイルの中間部で面内での磁束密度分布を一様とし、しかも磁束の向きを広い範囲にわたって軸方向に揃えることができる。このため面積の広いウエハに対しても均一にエッチングをすることができ、またウエハ支持台の高さ調節もより容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のECR型イオン源をエッチング装置として用いる場合の概略断面図。

【図2】従来例に係るECR型イオン源をエッチング装置として用いる場合の概略断面図。

【図3】従来例に係るECR型イオン源の外観斜視図。

【図4】従来例のECR型イオン源内部の軸中心より片側の部分の等磁束密度線図。

5

【図5】本発明の実施例に係るECR型イオン源内部の軸中心より片側の部分の等磁束密度線図。

【図6】従来例のECR型イオン源内部の磁束密度の2軸成分Bzと半径方向成分Brの比|Br/Bz|が、0.05である地点を示す軸中心より片側の部分の軌跡図。

【図7】本発明の実施例に係るECR型イオン源内部に 於いて|Br/Bz|=0.05である地点を示す軸中 心より片側の部分の軌跡図。

【符号の説明】

1 励磁コイル

2 真空チャンバ

3 鉄心

4 マイクロ波導入窓

5 ウエハ

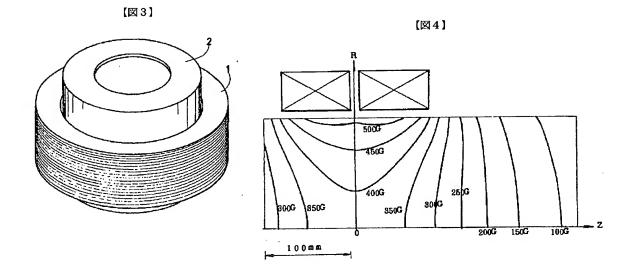
6 ウエハ支持台

7 導波管

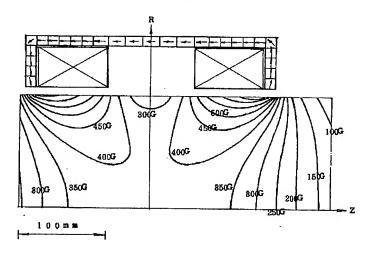
8 マイクロ波源

9 ガス入口

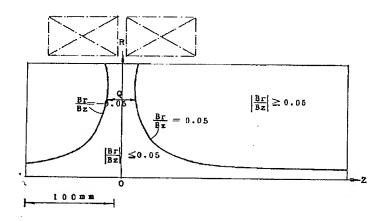
10







[図6]



【図7】

